

Editorial

W. Osten

- 411 Analyse und Modellierung technischer Oberflächen mit kombinativer Lasermeßtechnik**
Analysis and Modeling of Technical Surfaces with Combinative Laser Metrology

Aufsätze · Papers

W. Osten, P. Andrä, D. Kayser

- 413 Hochauflösende Vermessung ausgedehnter technischer Oberflächen mit skalierbarer Topometrie**
Highly-Resolved Measurement of Extended Technical Surfaces with Scalable Topometry

H. J. Tiziani, R. Windecker, M. Wegner, K. Leonhardt, D. Steudle, M. Fleischer

- 429 Messung und Beschreibung von Mikrostrukturen unter Berücksichtigung materialspezifischer Eigenschaften**
Measurement and Description of Microstructures with Consideration of Material-Specific Characteristics

A. Duparré, G. Notni, R.-J. Recknagel, T. Feigl, S. Glied

- 437 Hochauflösende Topometrie im Kontext globaler Makrostrukturen**
High Resolution Topometry in Conjunction with Macro Structures

H. Jennewein, Th. Ganz, H. Gottschling, Th. Tschudi

- 447 Hochpräzise optische Profilometrie an Proben mit variierenden Materialien**
High-Precision Optical Profilometry at Surfaces with Varying Materials

W. Holzapfel, U. Neuschaefer-Rube, J. Doberitzsch, F. Wirth

- 455 Präzise Strukturmeßtechnik mit lasergestützter Mikroellipsometrie**
Precise Structure Measurement using Laser-Based Microellipsometry

T. Fricke-Begemann, G. Gülker, K. D. Hinsch, K. Wolff

- 463 Analyse dynamischer Vorgänge an technischen Oberflächen mit Speckle-Korrelation**
Analysis of Surface Processes by Means of Speckle-Correlation

Rubriken · Columns

- 470 Literatur · Literature**
470 Produktinformationen · Product Information
472 Veranstaltungskalender · Events Calendar